

書籍のご案内

超音波探傷試験Ⅱ

編集：(社)日本非破壊検査協会

編集委員長 白井 越朗

体裁：B5版，200頁

定価：本体4,381円＋税（送料別）

本書は超音波レベル2技術者がマスターしておかなければならない基礎理論とその背景，探傷に必要な装置及びその性能測定，各種試験片，適用方法，きずの評価方法等について理解しやすいように編集した。また，特にISOレベル2技術者の業務範囲として，レベル1技術者に対する作業指示書の作成があり，これに必要な「NDT手順」及び「NDT指示書」にも重点をおいて改訂した。

なお，文中多くの場合，JIS Z 2300の定義により探傷結果から判断される不連続部を「きず」と表現しているが，規格によっては「欠陥」と表現しているもの，及び業界で一般的に「溶接欠陥」と呼ばれているものは一部そのまま「欠陥」と表現した。

また，本書改訂作業中に「JIS Z 3060」も同時改定中であり，その制定期日が本書発行と同時期になる可能性が高かったため，読者の便を考慮して，超音波分科会等で発表され，新規格に確実に含まれると思われる内容（特に試験片関係）を可能な限り先取りして編集した。

しかしながら，規格改定に伴う過渡期の現象については読者の方もその内容，制定日には十分注意を払っていただきたい。

以下に目次を示す。

- 1 非破壊試験技術者の役割と安全衛生
- 2 超音波探傷の基礎
- 3 探傷装置
- 4 探傷装置の性能と点検
- 5 試験片
- 6 超音波探傷の基本と応用
- 7 きずの評価
- 8 探傷の実際
- 9 保守検査
- 10 品質マニュアル，仕様書，NDT手順及びNDT指示書
- 11 報告書

以上

